

3.2 Solarzellensimulation

Von der University of New South Wales gibt es ein sehr detailliertes Programm zur Simulation von Solarzellen. Es ist kostenlos und heißt PC1D. Installieren Sie einfach das Programm bei sich und "spielen" Sie mit den Parametern!

Gern das wollen wir nun auch machen und die Ergebnisse des Schnelldurchgangs durch die kristalline Zelle "abklopfen".

3.2.1 Die Ladungsträgerdichte der Diode

Das Beispiel "Diode.prm" ist eine Diode mit 1µm n-Halbleiter : $N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$
3µm p- : $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

der intrinsischen Konzentration $n_i \approx 2.6 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$

Stellen Sie sicher, daß die angelegte Spannung $V_a = 0$ gesetzt ist! Siehe Blatt 18 des letzten Vorlesung (Fig 4.4) erwarten wir, daß in der p-Region gilt:

$$P \approx N_A$$

$$n \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$

gleichfalls in der n-Region mit exponentiellem Übergang

zwischen den Bereichen, da n_B bzw p exponentiell von $E_V - E_F$ bzw $E_C - E_F$ abhängt und in der Übergangszone diese Differenzen gründet werden (als Funktion von Ort) [Siehe Blatt 16, Fig 4.3] von letztem Mal.

In der Tat finden wir in der Simulation

$$\frac{n_i^2}{N_D} = 6.8 \cdot 10^{-5} \quad ; \quad \frac{n_i^2}{N_A} = 6.8 \cdot 10^{-4}$$

3.2.2 Minority Carries Injection

Nach ein wenig Rechnung, die wir zu diesem Zeitpunkt nicht machen wollen, findet man, dass die Minoritätsladungsträger am Rande der Verarmungszone exponentiell von einer äußeren angesetzten Spannung ~~ab~~ hängt. abhängt:

$$n_x (x = \text{Rand der Verarmungszone p-seitig}) \propto e^{\frac{qV_a}{kT}}$$

Mit $T = 300 \text{ K}$; $k_B = \frac{1}{11000} \frac{\text{eV}}{\text{K}}$ wählen wir

z.B. $V_a = 0.3 \text{ V}$:

$$\frac{qV_a}{kT} = \frac{0.3 \text{ eV}}{300 \frac{1}{11000} \frac{\text{eV}}{\text{K}}} = 11$$

$$\rightarrow e'' \approx 6 \cdot 10^4$$

und wir erwarten für $p = \frac{n_i^2}{N_D} \cdot e'' \approx 4 \text{ cm}^{-3}$

$$\text{bzw. } n = \frac{n_i^2}{N_A} \cdot e'' \approx 40 \text{ cm}^{-3}$$

Was in der Simulation auch schön bestätigt wird.

Nebenbei zu bemerkt, durch den raschen Abfall von

z.B. $n = N_D \rightarrow n = \frac{n_i^2}{N_A}$ in der Verarmungszone entsteht natürlich gerade die Raumladung, denn die N_D Phosphoratome sind nicht länger von $n_i = n_e^-$ abgeschirmt, sondern von exponentiell weniger vorhandenen n , so daß N_D positive Ladungen übrig bleiben (siehe Blatt 19, Figur 4.5).

3.2.3 Elektrisches Feld in der Raumladungszone

Schauen wir nochmals auf Figur 4.5:

Es bildet sich nun also eine Raumladungszone mit

$S = qN_A$ auf der p-Seite und $S = qN_D$ auf der n-Seite. Da Breiten b_p und b_n in dieser S diese Werte hat kann man sozusagen E rückwärts

berechnen und zwar so:

- ① Wir wissen, daß (Fig 4.3)

$$\Psi_0 = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

Setzen wir die Einfachheit $N_A = N_D = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ (?) .

Dann ist

$$\Psi_0 = \frac{300K \cdot 11000^{-1} \text{ eV/K}^x}{e} \ln \left(\frac{10^{34}}{(2.6 \cdot 10^6)^2} \right)$$

$$= 0.027 \cdot 21.2 \text{ V}$$

$$= \underline{\underline{0.57 \text{ V}}}$$

- ② Aufgrund von Fig 4.5 sieht man, daß

$$\Psi_0 = V(\infty) - V(-\infty)$$

$$= V(x_u) - V(x_p)$$

= Fläche unter ξ -Kurve

$$= -\frac{1}{2} (x_u - x_p) \xi_{\max}$$

$\underbrace{\quad}_{\equiv W}$ (Weite der Verarmungszone)

$$= -\frac{1}{2} W \xi_{\max}$$

③ f_{\max} ist aber doch die Gleichung

$$\frac{df}{dx} = \frac{q}{\epsilon} \text{ gegeben.}$$

$$f_{\max} = \int_{x_p}^0 \frac{df}{dx} dx = -\frac{q}{\epsilon} N_A (0 - x_p)$$

$$= \frac{q N_A}{\epsilon} x_p$$

Da $N_D = N_A$ ist aus Symmetriegründen $\forall x: x_p = x_n$,

$$W = 2x_p \Rightarrow f_{\max} = \frac{q N_A}{\epsilon} \frac{1}{2} W$$

Und aus ②:

$$f_{\max} = -\frac{2\psi_0}{W} \quad \text{Somit aus ③: } f_{\max} = \frac{q N_A}{\epsilon} \frac{1}{2} W$$

$$\Rightarrow -\frac{2\psi_0}{W} = \frac{1}{2} \frac{q N_A}{\epsilon} W$$

$$\Rightarrow \cancel{W^2} = \cancel{-\frac{4 \cdot q \psi_0 N_A}{\epsilon}} \quad W^2 = -\frac{4 \epsilon \psi_0}{q N_A}$$

$$\text{wobei: } \epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 = 13,2 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$q = -1 \cdot 6 \cdot 10^{-18} \text{ As}$$

$$N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3} = 10^{23} \text{ m}^{-3}$$

⑤

und somit

$$W = \left[\frac{4 \cdot 1.2 \cdot 10^{-10} \text{ As (Vm)}^{-1} \cdot 0.6 \text{ V}}{1.6 \text{ As} \cdot 10^{-19} \cdot 10^{23} \mu\text{m}^{-3}} \right]^{1/2}$$
$$= \left[\frac{2.4 \cdot 10^{-10} \mu\text{m}^2}{1.6 \cdot 10^4} \right]^{1/2}$$
$$= \sqrt{1.5 \cdot 10^{-14} \mu\text{m}} = \underline{\underline{0.13 \mu\text{m}}}$$

$$\varepsilon_{\max} \text{ ist aber } \varepsilon_{\max} = - \frac{2k_0}{W} = - 85 \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$

In der Simulation erhalte ich $\varepsilon_{\max} = 130 \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$ (das Vorzeichen ist Definitionssache)

3.2.4 Die Solarzelle in der Simulation

Die Datei "Pvcell.prm" enthält das Modell einer Solarzelle. Dabei wird die I-V Kurve durchfahren.

Ändern wir hier (und Sie drille auch!) einige Parameter, z.B.:

- τ_n und τ_p , die Lebensdauer von e^\ominus und Löchern im Kristall selbst durch Rekombination. Dies ist der Effekt von "schlechtem" Werkstoffmaterial
- Die Dicke der Zelle von $300\mu m \rightarrow 100\mu m \rightarrow 10\mu m$
- Wir schaue die Dotierungskonzentration an.
- Wir schaue den e^\ominus -Loch Generation + Recombination Plot an. Achtung: die Funktionen sind ab Integral bis zur jeweiligen Position! Was ist bei peak doping $1.5 \cdot 10^{20}$ ($\cong 30 \Omega/\text{sq}$) bzw. $3.5 \cdot 10^{20}$ ($\cong 40 \Omega/\text{sq}$)?
- Anti-Reflex - Beschichtung
- Temperatur

3.3

Wichtige Kenngrößen von Solarzellen

Es werden für gewöhnlich drei Kenngrößen zur Charakterisierung der Leistung einer Zelle angegeben.

Erstens die des Kurzschlussstrom I_{sc} . Idealexpekt ist dieser gleich dem Strom welches durch Lichteinfall erzeugt wird. Zweitens die Leerlaufspannung V_{oc} . Setzt man idealisiert $I = I_0 (e^{qV/kT} - 1) - I_L = 0$ V_{oc} so findet man

$$V_{oc} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I_L}{I_0} + 1 \right)$$

Die Leistung der Zelle ist gleich der Fläche im IV. Quadranten der $I-U$ Kurve. Sie wird maximal bei einer Kombination aus I_{mp} und V_{mp} (oder anders gesagt: $\frac{\partial P}{\partial V} \Big|_{V_{mp}} = \frac{\partial P}{\partial I} \Big|_{I_{mp}} = 0$)

Der dritte Parameter ist der sogenannte Füllfaktor FF, der angibt wie "rechteckig" die Ausgangscharakteristik der Zelle im $I(U)$ Diagramm ist, d.h. welchen Prozentsatz von $P_{rectangular} = V_{oc} I_{sc}$ man unterschreiten kann:

$$FF = \frac{V_{mp} I_{mp}}{V_{oc} I_{sc}}$$

Der Wirkungsgrad der Zelle ist natürlich

$$\eta = \frac{V_{mp} I_{mp}}{P_{in}} = \frac{V_{oc} I_{sc} FF}{P_{in}}$$

⑧ mit P_{in} der Eingangsleistung der Strahlung.

Für Geld kann man zur Zeit Zellen mit 21% Wirkungsgrad kaufen. Typisch sind aber 14-18%.

3.3.1 Effizienzgrenzen der Solarzelle

Als obere Grenze des Kurzschlussstromes gilt sicherlich die Annahme, daß alle Photonen mit $E_g > E_g$ ein e^- -Loch für erzeugen, welches zum Strom beiträgt (siehe Folie)

Die Leerlaufspannung hängt wiederum vom Dioden Sättigungsstrom I_0 ab. I_0 muß möglichst klein sein. Für Silizium ergibt sich $V_{oc} \approx 700\text{mV}$.

Am sensibelsten hängt I_0^2 vom Halbleitermaterial ab:

$$I_0^2 = N_c N_v \exp(-E_g/kT)$$

Und eine gute Schätzung für I_0 als Funktion von E_g ist dann

$$I_0 = 1.5 \cdot 10^5 \exp(-E_g/kT) \text{ A/cm}^2$$

Da $V_{oc} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I_L}{I_0} + 1 \right)$ folgt daraus, daß:

V : E_g größer $\rightarrow I_0$ kleiner $\rightarrow V_{oc}$ größer

I : E_g größer $\rightarrow I_{sc}$ kleiner (wenige Photonen haben $E_g > E_g$!)

⑨ Woran man sieht, daß es ein Optimum geben muß. (Folie)

Der Hauptgrund für die den niedrigen Wirkungsgrad der Solarzelle ist, daß für alle δ mit $E_\delta > E_g$

Mur die Energie E_g verwertbar ist. Dies limitiert die maximal mögliche Effizienz allein schon auf 44%.

Doch es kommt noch schlimmer: Wie wir gesehen haben wird davon nur die Spannung 700 mV für Silizium erzeugt, obgleich die Ladungsträger $E_g \approx 1.1 \text{ eV}$ Energie erhalten hatten (plus die vorgebrachten $E_\delta - E_g$!).

d.h. es bleibt davon auch nur maximal

$$\frac{qV_{oc}}{E_g} \approx \frac{0.7}{1.1} \approx 60\% \text{ für Silizium}$$

Die künftig zu erwartenden Zellen mit 2x Wirkungsgrad sind somit schon sehr sehr gut!

3.4. ERSATZSCHALTBLD., ZUSAMMENSCHALTUNG + ABSCHATTUNG

Wir haben die Strom-Spannungskurve der beleuchteten Zelle in der letzten Vorlesung berechnet:

$$I = I_0 [e^{\frac{qU}{kT}} - 1] - I_L$$

wobei

$$I_0 = A \left[\frac{qDe^{\frac{qU}{kT}}}{LeNA} + \frac{qDe^{\frac{qU}{kT}}}{LeND} \right]$$

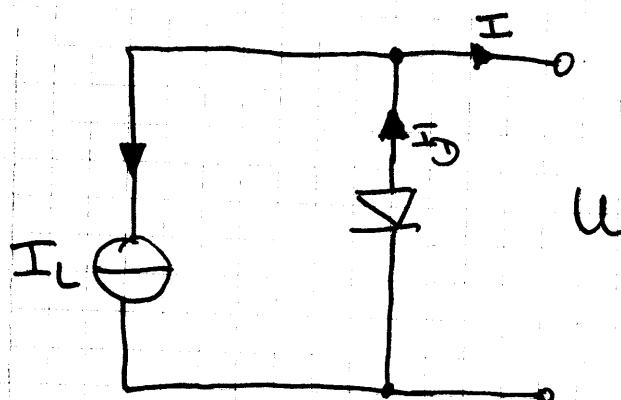
Von der unbeschalteten Zelle abhängt und

$$I_L = qAG [L_e + \omega + L_h]$$

Von den Zellparametern, sowie der Erregungsrate G abhängt. Nimmt man L_e, ω, L_h als konstanten in großer Näherung an (d.h. keine große T Abhängigkeit), so kann man auch vereinfacht schreiben

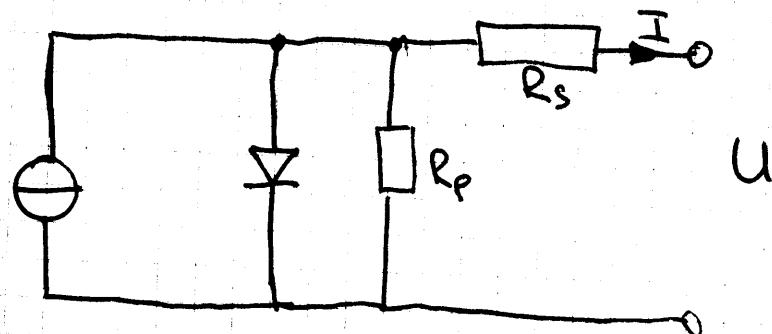
$$I_L = \text{const} \cdot G$$

Und ein einfaches Ersatzschaltbild der Zelle ist



Mit der Stromquelle $I_L = \text{const.}$

Dieses einfache Bild ist auf wenige Prozent genau.
Man kann es natürlich sehr verfeinern, bsp.
durch den Spannungsabfall zwischen dem Halbleiter
und den äußeren Kontakten (ausgeübt durch
einen Steckwiderstand R_s) und Leckströme längs
der Zellumkante (beschrieben durch R_p):

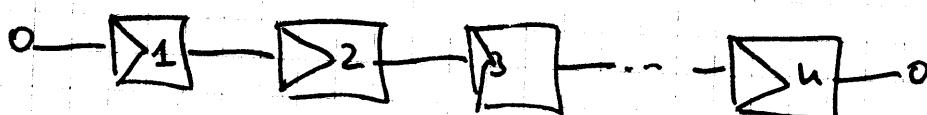


$$R_s \approx 1 \Omega \text{ Bereich}$$

$$R_p \gtrsim 10 \Omega$$

Reihenschaltung:

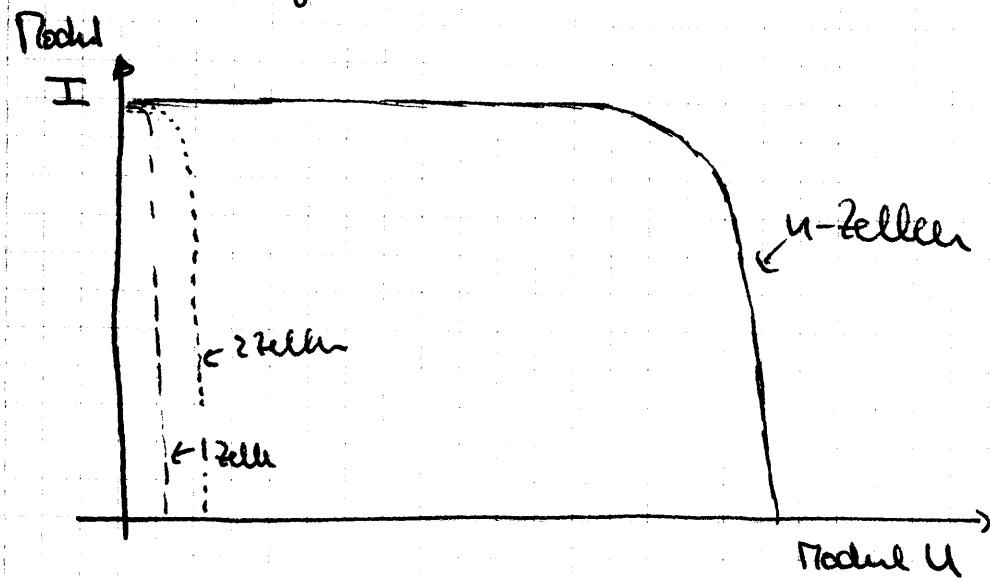
Um auf höhere Spannungen zu kommen, werden Zellen in Reihe geschaltet.



$$\Rightarrow I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

$$U = \sum_{i=1}^n U_i$$

und die Produktkennlinie kann im Fall von n identischen Zellen einfach aus den Einzelkennlinien zusammengesetzt werden:

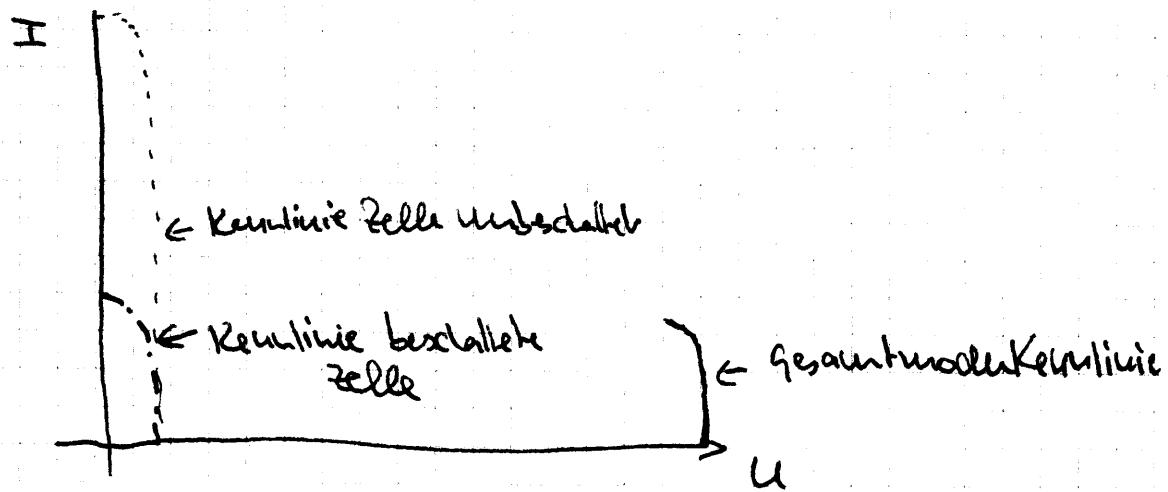


Abschaltung

Nehmen wir als Bsp an, dass eine Zelle zu 75% abgeschaltet ist und das Modul insgesamt aus 36 Zellen besteht. Dann ist

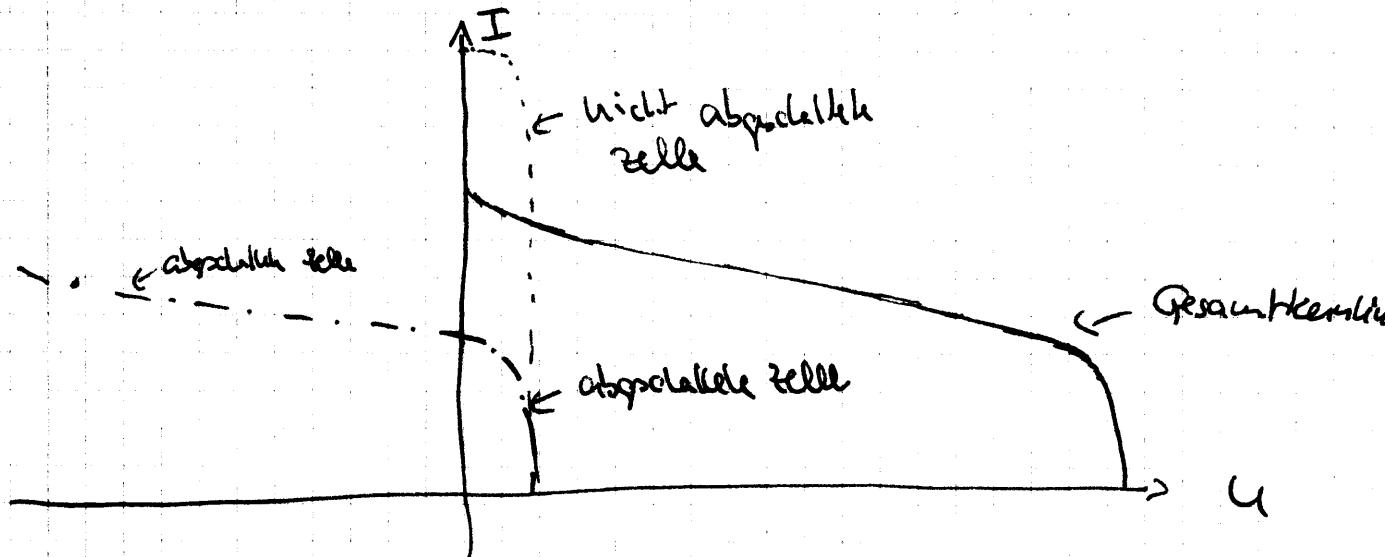
$$U = U_a(I) + 35U_b(I)$$

Und man fängt am höchsten von $I=0$ an, die Produktkennlinie zu konstruieren:



Bis zum Kurzschlußstrom der beschalteten Zelle ist die Konstruktion nicht schwierig, allerdings gelingt dies nur für ein kurzes Stück der Nodul-Kurve.

Offensichtlich muß, um die Kurve zu vervollständigen, ein größerer Strom durch die abschaltete Zelle als den Kurzschlußstrom? Das geht aber nur bei negativer Spannung an dieser Zelle? Unsere Zelle läuft zum Verbrande?



Die Nodulleistung nimmt durch Abschaltung rapide ab. Obwohl nur 2% des Noduls in unserem Beispiel abschaltet waren, sinkt die Nodulleistung um ca. 70%. Dabei kann die abschaltete Zelle soviel Leistung aufnehmen, daß sie durch Überhitzung zerstört werden kann?

Um das zu verhindern werden parallel zu den einzelnen Zellen oder aber Gruppen von Zellen Bypassdioden geschaltet. Sie begrenzen die negative Spannung auf einer abschalteten Zelle.